



F-6975

誘電率 温度及び周波数依存

Dielectric constant Temperature and frequency dependence

TECHNICAL
INFORMATION2019.11.28
D-TI-00F6975-094-A
1/1

1. 目的 Purpose

エピフォームF-6975の硬化物の誘電率を温度と周波数を変えて測定いたしました。

Dielectric constant of the cured product of Epiform F-6975 was measured at various temperatures and frequencies.

2. 条件 Condition

サンプル Sample

エピフォーム Epiform F-6975

硬化条件 Cured condition

190°C × 20min.

硬化物膜厚 Cured product thickness

3.0 mm

周波数 Frequency

1kHz、1MHz

温度 Temperature

25°C、50°C、100°C、120°C、130°C、140°C、150°C、160°C

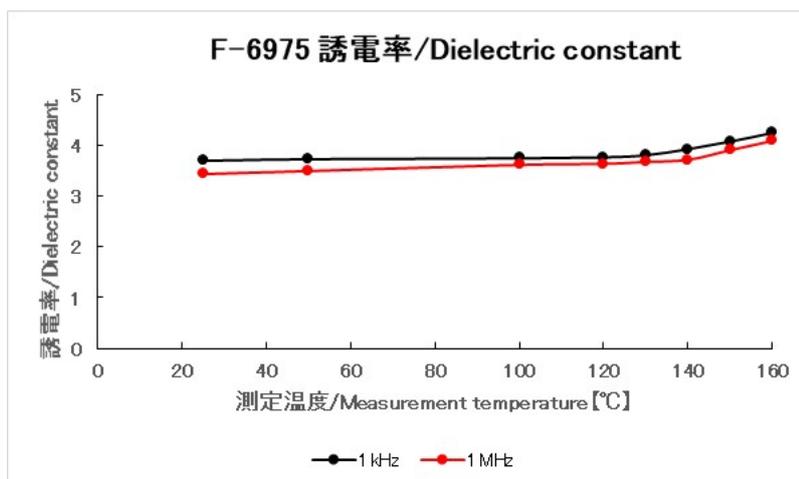
測定装置 Measuring device

安藤電気株式会社 TR-10C型誘電体損測定機

Ando Electric Co., Ltd. TR-10Ctype Dielectric loss measuring instruments

3. 結果 Result

周波数 Frequency	温度 Temperature							
	25°C	50°C	100°C	120°C	130°C	140°C	150°C	160°C
1kHz	3.71	3.74	3.76	3.78	3.82	3.94	4.09	4.26
1MHz	3.45	3.51	3.63	3.65	3.69	3.73	3.92	4.10



本インフォメーションに記載されている値は代表値であって、規格値ではありません。
The information recorded in this report are measured values, not standard values